

集成电路失效分析

产品名称	集成电路失效分析
公司名称	广电计量检测集团股份有限公司东莞分公司
价格	888.00/1
规格参数	
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路6号1栋101-106室（注册地址）
联系电话	13433435732

产品详情

元器件: 第三代半导体/高功率器件/新能源/科研开展

-器件筛选

-器件验证测试(车规/航天&轨道交通应用)

-元器件级材料分析

-器件结构分析& 竞品分析

集成电路: 集成电路SOC & 模块(MCM)分析验证/半导体材料分析/车规应用

- NPI / RP / MP验证与失效分析

-半导体材料结构分析

-集成电路芯片筛选&破坏性物理分析

-竞品分析

元器件与集成电路

无损检测分析：X射线透视、声学扫描显微镜、光学显微镜、粒子碰撞噪声、检漏；

电性能分析：电特性曲线量测、微探针台、器件测试；

破坏性分析：水汽及内部气体成份、芯片开封、切片、去层、推拉力测试(WBS、WBP)等

失效分析：失效点定位、芯片去层、微观检查、电路确认与失效机理判定

精密显微镜分析：扫描电子显微镜等、双束聚焦离子显微镜

综合性分析：整合失效分析、破坏性物理分析(DPA)、元器件筛选&二筛验证

芯片验证：可靠性寿命验证、ESD静电测试、材料分析、封装验证、热阻测试。

PCBA应用

无损检测分析：X射线透视、声学扫描显微镜、红外热成像等；

电气性能检测：表面绝缘电阻（SIR）、体积电阻率、击穿强度等；

焊接质量机械性能分析：芯片推剪、键合带拉力、染色与渗透等；

板极组件切片制样：自动切割、研磨、抛光、微腐蚀等；

焊点缺陷检测：体视显微镜、金相显微镜、大景深显微镜、扫描电子显微镜等；

组装物料成分检测：EDX、色谱、FTIR、XRF膜厚分析

清洁度检测：离子色谱、电导率等效当量法等。

热机械性能分析：差示扫描量热法、

可靠性验证(RA)

芯片级预处理(PC) & MSL试验, J-STD-020 & JESD22-A113

高温存储试验(HTSL), JESD22-A103

温度循环试验(TC), JESD22-A104

温湿度试验(TH / THB), JESD22-A101

高加速应力试验(HTST / HAST), JESD22-A110

高温老化寿命试验(HTOL), JESD22-A108

芯片静电测试

人体放电模式测试(HBM), JS001 (2/E) (ESD)

元器件充放电模式测试(CDM), JS002

闩锁测试(LU), JESD78

TLP

Surge / EOS / EFT

失效分析

光学检查(VI/OM) (FA)

扫描电镜检查(FIB/SEM)

微光分析定位(EMMI/InGaAs)

OBIRCH

微探针测试(Micro-probe) 聚焦离子束微观分析(FIB)

弹坑试验(cratering)

芯片开封(decap) (FA)

芯片去层(delayer)

晶格缺陷试验(化学法)

PN结染色 / 码染色试验 推拉力测试(WBP/WBS) 红墨水试验

PCBA切片分析(X-section)

Solderability (FA)

Dye and Pry

93K ATH with三温handler

水汽及内部气体成份分析

PIND粒子碰撞噪声 粗检漏、细检漏

材料分析

高分辨TEM (形貌、膜厚测量、电子衍射、STEM、HAADF)

SEM (形貌观察、截面观察、膜厚测量、EBSD)

Raman (Raman光谱)

AFM (微观表面形貌分析、台阶测量) T3Ster (热阻测试仪)

此文摘自http://www.grgtest-gdjl.com/jcdl.html#_np=2_695

我们的地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路6号1栋101-106、208、210、212、214-217电话：13

433435732联系手机：13433435732 期待您的咨询